

3. 光ファイバの熱発光特性を利用した ガンマ線照射環境下におけるその場温度計測の基礎研究

3. Fundamental Study on In-Situ Temperature Measurement with Thermoluminescence Characteristics of Optical Fibers under Gamma-Ray Irradiation

土屋 文,藤 健太郎¹⁾ TSUCHIYA Bun and TOH Kentaro¹⁾ 名城大学理工学部,¹⁾日本原子力研究開発機構 (原稿受付:2013年11月5日)

大気雰囲気および1273 Kまでの高温環境下において, 0.16 mGy/sの線量率のガンマ線を純粋溶融石英(シリ カ) コア光ファイバに照射しながら熱発光および光透過スペクトルをその場で測定し,光ファイバの光学的特性 に対する放射線照射誘起効果について調べた.873 K以上において,熱発光ピークが1240 nm および1390 nm の波長に現れ,発光強度がガンマ線照射下においても加熱温度に対して指数関数的に増加することがわかった. 同時に行った光透過測定により,これらの熱発光は光ファイバのコア内に存在する Si-OH 基の熱振動によること が判明した.これらの熱発光ピーク強度に対する温度依存性を利用することにより,温度上昇時の温度計測が可 能であるが,1273 K の温度一定に保持した場合,発光強度は約 100 hrs までは増加し,その後は減少した.発光ス ペクトル内の黒体放射によるブロードピークの出現および高分解能透過型電子顕微鏡(HR-TEM)を用いたシリ カの結晶成長の観測により,これらの発光強度の変化は非架橋酸素正孔センター(NBOHC),酸素欠乏センター (ODCs)等のガンマ線照射誘起欠陥と水との反応による Si-OH 基の生成および光の漏洩が要因であると考えられ る.光ファイバの熱発光特性を利用した温度計測を確立するためには,計測時間を短縮することや光ファイバの 先端を金属で被覆して大気および水に触れないように工夫する必要がある.

Keywords:

gamma-ray irradiation, pure fused silica-core optical fibers, thermoluminescence, optical transmission, non-bridging oxygen hole center, oxygen deficiency centers

3.1 はじめに

光ファイバは電磁ノイズの影響を受けないことから,原 子炉や核融合炉内の放射線環境下の情報を得るための新規 な遠隔計測装置の一つとして注目されている[1-11].特 に,加熱された光ファイバ自身によって発生する熱発光の 強度は温度に依存することから,炉内の温度計測センサー としての適用が期待されている.純粋溶融石英(シリカ) コア光ファイバを熱すると1390 nmに大きなピークが観察 される.これは光ファイバ中に含まれる Si-OH 基による熱 発光であり,この発光強度から温度を計測することが可能 であると考えられている[1-3].

本研究では大気,1273 K の高温領域およびガンマ線(線 量率:0.16 mGy/s) 照射下において,シリカコア光ファイ バ中のアモルファス-シリカ(SiO₂)の光吸収および発光測 定をその場で行い,SiO₂の光学的特性に対する放射線照射 誘起効果について調べた.さらに,1273 K の高温領域で 210~250時間加熱されたSiO₂の構造を高分解能透過電子 顕微鏡(HR-TEM: High-resolution Transmission Electron Microscope, JEM4000EX)を用いて観測し,熱発光および 光吸収特性に対する結晶成長の影響について調べた.

3.2 実験

本実験では、純粋溶融石英コア光ファイバが使用された.この光ファイバはステップインデックス型であり、コ ア径およびクラッド径はそれぞれ200および250µm、長さ は9.8 m、Si-OH 濃度は約0.001 ppmであった.図1に示す ように、この光ファイバを東北大学のガンマ線照射施設に 設置されたコバルト(⁶⁰Co)線源周りに置き、大気雰囲気に おいて1.17 および1.33 MeVのガンマ線を照射しながら室 温から1273 Kまで電気炉を用いて加熱した.光ファイバの ジャケットの上から直接加熱し、その加熱された長さは約 30 cmであった.光ファイバの両端はそれぞれ白色光源 (AQ4303B、安藤電気)とスペクトラムアナライザ(AQ 6315A、安藤電気)に接続され、ガンマ線照射セル内から 外側まで一本でつなげられた.1273 Kまでの温度上昇時お よび1273 Kの一定温度に加熱保持された光ファイバの熱

Faculty of Science and Technology, Meijo University, Nagoya, AICHI 468-8502, Japan

Corresponding author's e-mail: btsuchiya@meijo-u.ac.jp



図1 ガンマ線照射環境下における光ファイバの熱発光および光 透過その場測定.

発光および光透過スペクトルを350から1750 nm の波長ま でその場で測定し,熱発光および光吸収特性に対する放射 線効果について調べた.このときのガンマ線吸収線量率は 0.16 mGy/s であった.また,1273 K に達した後,一定温度 で約210~250時間まで保持し,その間に熱発光および光吸 収測定を行った.

3.3 結果および考察

(1) 光ファイバの熱発光スペクトル

ガンマ照射下において、光ファイバを室温から1273 K まで加熱することにより測定された熱発光スペクトルを 図2に示す.縦軸は発光強度,横軸は発光した光の波長を 表す. 873 K から 1390 nm の波長に発光ピークが観測され ることがわかった. この発光は 873 K 以下でも生じている と考えられるが、発光強度が低いため、今回使用したスペ クトラムアナライザの感度では計測ができないと考えられ る.この発光ピークの強度は、温度の増加と共に増加し、 さらに、小さな発光ピークが 1240 nm の波長にも観測され た.したがって、これらの発光ピークは、光ファイバ中に 形成された Si-OH 基の熱振動によると考えられる[1-3]. 図2中の1390 nmの発光ピークの強度を加熱温度:Tの逆 数(1000/T K⁻¹) に対してアレニウスプロットした結果を 図3に示す.図3から,発光強度は加熱温度の増加と共に 指数関数的に増加することが判明した.この結果は,873K からではあるが,発光強度を調べることにより,温度を評 価することが可能であることを示唆している.また,未照 射において、大気雰囲気でファイバを室温から徐々に加熱 しながら熱発光をその場で測定した.図3に示すように, 1390 nmの波長における発光ピークの強度は未照射試料の 発光強度に比べて若干低いが、ほぼ同様に1000/Tに対して 指数関数的に増加することがわかった.即ち、このデータ の一致は,今回の線量率の場合,放射線場において熱計測 が可能であることを示している.

1273 K の温度に達した後,時間変化に対する熱発光特性 について調べた.ガンマ線照射下において,1273 K の一定 温度で加熱された光ファイバの熱発光スペクトルを図4に 示す.約700から1750 nm までの波長における発光強度が



図 2 ガンマ線照射下において室温から 1273 K まで加熱された 光ファイバの熱発光スペクトル.



図3 未照射およびガンマ線照射下において加熱された光ファイ バの発光ピーク強度(1390 nm)の温度依存性.

約20hrsから時間と共に徐々に増加することがわかっ た. このバックグランドの増加は、光ファイバが時間と共 に徐々に壊れ、電気炉の光(黒体放射)[8]が光ファイバ内 に入り込んでいるためと考えられる.実際に、光ファイバ を白色光源からはずし、1273 K の温度まで上昇させた電気 炉の中にファイバを挿入すると、約700nm以上の波長の 黒体放射が873K以上から観測され、そのスペクトルの強 度が徐々に増加することを確認した. このバックグランド を差し引いたときの1390 nmにおける発光ピーク強度の時 間変化を図5に示す.1390 nm における発光ピークの強度 も約100 hrs までは時間と共に徐々に増加することがわ かった.約100 hrs 以上の照射では,1390 nm における発光 ピーク強度は増加しなくなり、逆に減少した.この時間依 存性は, Si-OH 基の濃度が約100 hrsの照射時間を境に増減 していることが考えられる.または、光ファイバが壊れ、 黒体放射を観測していることから、熱発光もファイバから

放出している(光漏洩)可能性がある. さらに,図5中の 未照射の場合と似ていることから,Si-OH 基の形成メカニ ズムは,放射線よりも熱的な効果が支配的であると考えら れる.

(2) 光ファイバの光透過スペクトル

図4および5中の熱発光強度の増減がSi-OH基の濃度に 依存しているかどうかを明らかにするため、白色光源を用 いた光透過測定が熱発光測定直後に実施された.ガンマ線 照射下において、1273 Kの一定温度で加熱された光ファイ バの時間変化に対する光透過スペクトルを図6に示す.縦 軸は約400 nmから約800 nmまでの可視光およびそれ以上 の赤外光における吸収強度、横軸は白色光源から光ファイ バに透過させた光の波長を表す.図6中の約600 nm付近 における段差は、検出器交換によるずれを表す.図6から、 約1390 nm付近において、光吸収ピークが観測され、また、 熱発光ピークと同様に、小さな光吸収ピークが1240 nm の波長にも観測された.これらの光吸収ピークは、光ファ



図4 ガンマ線照射下において、1273Kの一定温度で加熱された 光ファイバの時間に対する熱発光スペクトル.



図5 未照射およびガンマ線照射下において、1273 K で加熱され た光ファイバの 1390 nm における発光強度の時間変化.

イバ中に形成された Si-OH 基の熱振動によると報告されて おり[12-16],図4中の熱発光ピークにそれぞれ対応して いることがわかる.また,1390 nm 付近の光吸収ピーク強 度は,Si-OH基の濃度に依存するので,図6中の約1350 nm から約1500 nm までを直線でつなぎ,バックグランドとし て差し引き,1390 nm の光吸収量を求めた.その光吸量の 時間変化を未照射の場合の結果を含めて図7に示す.

ガンマ線照射下の場合,光吸収量は照射時間と共に増加 し続けることが判明した.即ち,この結果は,Si-OH基が形 成されつづけていることを示しており,未照射試料の結果 と比較をすると放射線効果が現れていることを示す.ま た,図6の光透過スペクトルから,光吸収強度は約470から 約900 nm までの範囲において照射時間の増加に伴い減少 し,それに反して,約1200から約1750 nm までの範囲では 増加する傾向があることがわかった.900 nm以下の波長領 域の可視光は,非架橋酸素正孔センター(NBOHC:Nonbridging Oxygen Hole Center, 650 nm (1.9 eV)),酸素欠



図6 ガンマ線照射下において、1273 Kの一定温度で加熱された 光ファイバの時間に対する光透過スペクトル.



図7 未照射およびガンマ線照射下において,1273 K で加熱され た光ファイバの1390 nm における光吸収量の時間変化.

 乏センター(酸素空孔欠陥)(ODCs: Oxygen Deficiency Centers, 460 nm (2.7 eV))[1,11,12]等の欠陥に吸収され ることが報告されているので、図8に示すように、ガンマ 線照射によって生成された NBOHC や ODCs 等の欠陥(照 射誘起欠陥)が光ファイバ内部に含まれる僅かな水(H₂O) あるいは大気中の水蒸気から解離して拡散した水素原子 (H)と結合し、Si-OH 基が形成され続けていると考えられ る[17].

未照射試料の場合,光吸収量は時間と共に増加するが,約 100 hrs からほぼ一定になることがわかった.未照射試料の光透過スペクトルからも,900 nm以下の波長領域の可視光の吸収が観測されたことから,作製時から存在する NBOHC や ODCs 等の欠陥以外にも 1273 K の高温加熱における熱的効果において生成された僅かな NBOHC および ODCs が H₂O および H と反応することにより Si-OH 基濃度 が増加し,熱発光強度が増加したと考えられる.100 hrs 以上になると,Si-OH 基生成量の減少に加えて,光ファイ バの損耗による光の漏洩によって,熱発光強度が減少した と推測される.光ファイバ内部のコアとクラッド間の界面 が Si および O 原子の熱拡散により乱れ,光の全反射が生じ にくくなり,光が外へ逃げていることが考えられる.



図8 ガンマ線照射下における光ファイバ内部の照射誘起欠陥形 成モデルおよび Si-OH 基形成モデル.

(3) 高分解能透過電子顕微鏡観察

ガンマ線照射下において,1273 Kの一定温度で250時間 まで加熱された光ファイバの HR-TEM 像および回折パ ターンを図9(b)に示す.直径約10 nm 程度の干渉縞が観 測された.また,回折パターンにスポットとデバイリング が現れ,シリカ(SiO₂)のアモルファス構造が結晶化して いることが判明された.図9(a)および(c)に示すように, 未照射下において,1273 Kの一定温度で210時間まで加熱 された光ファイバの HR-TEM 像は未照射および未加熱の 試料における HR-TEM 像は未照射および未加熱の 試料における HR-TEM像とほぼ同じく,アモルファス構造 が保持されていることから,NBOHC および ODCs 等の照 射誘起欠陥と H₂O および H との反応により形成された Si-OH 基同士の結合あるいは Si-OH 基のさらなるガンマ線照 射による分解等によって,SiO₂の結晶化が進行したと考え られる.このアモルファスシリカの結晶化が,約100 hrs 以降の発光の漏洩に大きく影響したと考えられる[3].

3.4 まとめ

大気雰囲気において、1273 Kまでの高温加熱された光 ファイバの熱発光および光透過特性に対するガンマ線照射 効果について調べた.光ファイバを873K以上に加熱する と、熱発光ピークが1240 nm および1390 nm の波長に現れ た. 光透過測定においても, 光吸収ピークが 1240 nm およ び1390 nmの波長に現れたことから、この熱発光は光ファ イバのコア内に存在する Si-OH 基の熱振動によると考えら れる.この熱発光ピークの強度は、ガンマ線照射下におい ても加熱温度に対して指数関数的に増加し、放射線環境下 のその場温度計測が光ファイバの熱発光特性を利用するこ とで可能であることが実証された.しかしながら,1273 K の温度で保持すると、光ファイバの熱発光強度は照射時間 の増加と共に徐々に増加した後、約100hrs以上では逆に 減少することがわかった.発光強度の増加は、ガンマ線照 射によって生成された NBOHC や ODCs 等の照射誘起欠陥 と光ファイバ内部に含まれる僅かなH2Oあるいは大気中の 水蒸気から解離して拡散した Hと結合して, Si-OH 基を新 しく形成するためと考えられる.黒体放射によるブロード ピークが熱発光スペクトルに観察されことや、シリカの結 晶化が HR-TEM 観察により判明したことから、約 100 hrs 以降における発光強度の減少は、光がコアおよびクラッド



図 9 (a)未照射および未加熱, (b)ガンマ線照射および加熱(1273 K, 250 hrs), (c)未照射および加熱(1273 K, 210 hrs)後の光ファイバの HR-TEM 像および回折パターン.

間の界面のみだれやシリカの結晶により散乱され,光ファ イバから漏洩したためと考えられる.したがって,光ファ イバを用いて放射線照射環境下においてその場で温度を計 測する場合は短時間で行うことや,大気中の水蒸気に触れ ないように光ファイバの先端を金(Au)等の金属でコー ティングしたり,真空雰囲気に保持するなどの工夫が必要 である.

参考文献

- [1] K. Toh et al., J. Nucl. Mater. 329, 1495 (2004).
- [2] A. Honda et al., J. Nucl. Mater. 367-370, 1117 (2007).
- [3] B. Tsuchiya et al., J. Nucl. Mater. 417, 810 (2011).
- [4] R.R. Dils, Appl. Phys. 54, 1198 (1983).
- [5] F. Jensen et al., Fus. Eng. Des. 42, 449 (1998).
- [6] R. Aymar and International Team, J. Nucl. Mater. **307-311**, 1 (2002).

- [7] T. Kakuta et al., Fus. Eng. Des. 41, 201 (1998).
- [8] A.H. Rose, J. Lightwave. Technol. 15, 808 (1997).
- [9] K. Okamoto et al., J. Nucl. Mater. 329-333, 1503 (2004).
- [10] B. Tsuchiya *et al.*, The International Symposium on Optical Science and Technology, SPIE's 47th Annual Meeting, Proceeding no. 4786-31, 210 (2002).
- [11] R. Reichle et al., J. Nucl. Mater. 290-293, 701 (2001).
- [12] B. Brichard et al., J. Non-Cryst. Solids 353, 466 (2007).
- [13] A.H. Rose and T.J. Bruno, J. Non-Cryst. Solids 231, 280 (1998).
- [14] D.B. Keck et al., Appl. Phys. Lett. 22, 307 (1973).
- [15] D.B. Keck and R. Tynes, Appl. Opt. 11, 1502 (1972).
- [16] O. Humbach et al., J. Non-Cryst. Solids 203, 19 (1996).
- [17] R. Salh and H.-J. Fitting, Phys. Stat. Sol (c) 4, No. 3, 901-904 (2007).

小特集執筆者紹介 20



健太郎 藤

日本原子力研究開発機構, J-PARC センター, 研究副主幹. 福岡県福岡市出身. 東北大学金属 材料研究所助手を経て現職に従事.専門は放 射線計測,放射線物理.現在はガス型中性子二 次元検出器を開発中.座右の銘は「役不足」.



中村龍也

日本原子力研究開発機構, J-PARC センター, 研究副主幹.広島県東広島市出身.イギリス・ ラザフォードアップルトン研究所客員研究員 を経て現職に従事.専門は放射線計測.現在は

タ型中性子検出器を開発中.座右の銘は「千三つ」.



っちゃ ず

名城大学理工学部,准教授.神奈川県横浜市出 身. 名古屋大学大学院工学研究科結晶材料工 学専攻博士後期課程修了.最近は、ペロブスカ イトおよびパイロクロア型酸化物セラミック

ス中の水素およびヘリウム挙動について研究を進めています.



永田晋二

昭和40年代に小鳩幼稚園(東京都大田区)を卒 園.現在,東北大学金属材料研究所准教授.イ オンビームを用いて固体内の水素挙動や光学 特性変化を調べています.16年ぶりに新しい

車を手に入れましたが、運転席に座るたびにキーホルダーを 持った右手をハンドル下に突っ込み, 駐車するたびに左手を 握ってしまい,苦笑しております.



大野哲靖

名古屋大学大学院工学研究科エネルギー理工 学専攻 教授. 主な研究は核融合周辺プラズ マ物理およびプラズマー壁相互作用. 心臓手 術を仕事を断る切り札にしてきたが、最近は

前より元気そうだと言われ、切り札の効力が消失気味. 喜ぶべ きか悲しむべきか.



まっ なみ のり あき 松 波 紀 明

名城大学理工学部非常勤講師.研究分野は低 エネルギーから高エネルギーのイオンビーム による材料物性改 質とイオンビーム材料分 析です. イオンビーム特有な物性改質の非熱

的効果,酸化物 中の水素検出と水素の役割を追求していま す.趣味は読書(サスペンス,歴史).



安堂正已

00

日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部 門 核融合炉構造材料開発グループ.愛知県 出身. 主な研究分野は、金属材料の照射効果 (硬化) に関する研究. 今回の小特集で, 貴重

な機会をいただき感謝しております.2010年秋に青森に赴任 して、4回目の冬ですが、また慣れない雪・氷と戯れておりま す.今日も一面真っ白!です.何事もないことを切に祈るこの 頃です.



廣瀬貴規

2002年京都大学大学院エネルギー科学研究科 博士後期課程修了. 日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門核融合エネルギー工学研 究開発ユニット ブランケット工学研究グ ループ所属.趣味は自転車.モットーは Burn fat not oil.



谷川博康

日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部 門 核融合炉構造材料開発グループ 研究主 幹, 専門分野: 核融合炉構造材料, 照射効果照 射効果が引き起こす事象は厄介ですが、その

複雑な世界に学問的魅力を感じつつ, TBM 製造, 原型炉建設 を目指して構造材料研究開発をおこなっています.



野澤貴史

日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門 核融合炉構造材料開発グループ研究員, 京都 大学エネルギー科学研究科博士後期課程修 了,博士(エネルギー科学).核融合炉構造材

料 (SiC/SiC 複合材料, F82H HIP 接合体)の強度評価,照射試 験技術開発に従事.最近は,脆性的材料の規格・基準策定に興 味あり.家族(妻と娘)との時間を最優先に、研究活動との両 立を模索中.